

高電圧パッケージ(太陽電池モジュール、パワー半導体、メタル基板)の
耐電圧試験・絶縁能力評価試験に

DC耐圧12kV、絶縁抵抗5kVに対応



安全規格試験器

GPT-15012

DC耐電圧試験(DCW)

0.050kV～12.00kV

0.001mA～2mA 0.05kV ≤ V ≤ 0.5kV

0.001mA～10mA 0.5kV < V ≤ 12kV

絶縁抵抗試験(IR)

50V～5000V

0.100MΩ～10.00GΩ 50V ≤ V ≤ 100V

0.100MΩ～20.00GΩ 150V ≤ V ≤ 450V

0.100MΩ～50.00GΩ 500V ≤ V ≤ 5000V

- ・ 見やすい7インチカラーディスプレイ搭載
- ・ 電圧上昇(Ramp-up)と電圧下降(Ramp-down)の時間を独立設定可能
- ・ 測定データの統計分析可能
- ・ 最大出力電圧 DCW 12kV、IR 5kV
- ・ PCがなくても本体またはUSBメモリに測定データを保存可能
- ・ 最短測定時間0.3秒
- ・ 電圧/電流/抵抗の時間変化をグラフ表示するスweep機能搭載
- ・ 多彩なインタフェース機能(標準:USB,RS-232C / オプション:LAN,GP-IB)とインターロック機能
- ・ 組込みに便利なリアパネルに出力端子付き
- ・ バーコードリーダーに対応し、容易な設定変更
- ・ 入力電圧切り換え不用のワールドワイド入力

テクシオの豊富な安全規格試験器ファミリー



安全規格試験器
(200VA)

GPT-12003

安全規格試験器
(500VA)

GPT-15000 Series

安全規格試験器
(500VA)

GPT-9900 Series

安全規格試験器
(200VA)

GPT-9800 Series

8ch安全規格試験器

GPT-9500 Series

漏れ電流試験器

GLC-10000

一般項目

ディスプレイ	7型カラーLCD
メモリ	自動(AUTO)/単独(MANUAL)モードを合計100個保存可能
電源	AC 100V～240V±10%、50Hz/60Hz
消費電力	400VA MAX.
アクセサリ	電源ケーブル×1、インターロックキー×1、 テストケーブルGHT-120×1 リモートケーブルGHT-119×1

寸法 質量	約380mm(W) x 148mm(H) x 492mm(D) ※突起物を含む 約9.8kg
----------	---

環境項目

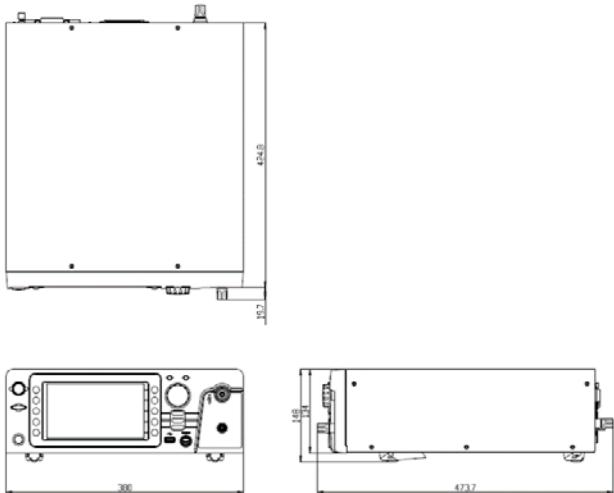
適用範囲	温度	湿度
保証	15℃～35℃	70%以下(結露のないこと)
動作時	0℃～40℃	70%以下(結露のないこと)
保存時	－10℃～＋70℃	85%以下(結露のないこと)
設置場所	標高2000m以下の室内	
EMC	EN61326-1(ClassA)、2014/30/EU準拠	
LVD	EN61010-1(Class1、汚染度2)、2014/35/EU準拠	

DC耐電圧

出力電圧範囲	0.050kV～12.00kV※1		
出力電圧分解能	1V/10V		
出力電圧精度	±(設定の1%+5V)、無負荷時		
最大定格負荷(表1)	120W(12kV/10mA)		
最大定格電流	10mA 0.001mA～2mA(0.05kV≦V≦0.5kV) 0.001mA～10mA(0.5kV<V≦12kV)		
電圧計精度	±(読み値の1%+5V)		
電圧レギュレーション	±(1%+5V) [最大定格負荷 → 無負荷]		
電流測定レンジ	0.001mA～10.00mA		
電流最高分解能	0.1μA		
	0.1μA (0.1μA～ 999.9μA)	1μA(1μA～ 9.999mA)	10μA (10.00mA)
電流測定精度	±(読み値の1.5%+3μA) (I < 1mA) ±(読み値の1.5% +30μA) (I ≧ 1mA)		
判定精度	±(設定値の3%+30μA)		
電流オフセット	5μAmax		
ウィンドウコンパレータ方式	○		
部分放電(ARC)検出	○		
上昇時間制御機能	○		
RAMP TIME(上昇時間)	0.1～999.9s		
下降時間制御機能	○		
RAMP DOWN(下降時間)	0.0～999.9s		
タイマー(試験時間)	OFF、0.3s～999.9s		
タイマー精度	±(100ppm+20ms)		
WAIT TIME (判定保留時間)	0.0～999.9s		
容量負荷最大値	1μF (10秒以下で放電可能な最大値)		

※1 50V/2mAの設定電圧に達するには、少なくとも0.3秒が必要になります。

外観寸法図/Dimensions



絶縁抵抗(IR)試験

出力電圧範囲	50V～5000V	
出力電圧分解能	50V	
出力電圧精度	±(設定の1%+5V)、無負荷時	
抵抗測定レンジ	0.1MΩ～50GΩ	
抵抗分解能	抵抗範囲	分解能
	0.1MΩ～999.9MΩ	0.1MΩ
	1.000GΩ～9.999GΩ	0.001GΩ
	10.00GΩ～50.00GΩ	0.01GΩ
試験電圧	測定レンジ	精度
50V≦V≦450V	0.1MΩ～1MΩ	読み値の5%+3カウント
	1MΩ～50MΩ	読み値の5%+1カウント
	51MΩ～2GΩ	読み値の10%+1カウント
500V≦V≦1200V	0.1MΩ～1MΩ	読み値の5%+3カウント
	1MΩ～500MΩ	読み値の5%+1カウント
	501MΩ～9.999GΩ	読み値の10%+1カウント
	10G～50GΩ	読み値の20%+1カウント※2
1250V≦V≦5000V	0.1MΩ～1MΩ	読み値の5%+3カウント
	1.1MΩ～500MΩ	読み値の10%+1カウント
	500.1MΩ～9.999GΩ	読み値の10%+1カウント
	10G～50GΩ	読み値の15%+1カウント※2

試験電圧	測定値表示範囲	
50V≦V≦100V	0.100MΩ～10.00GΩ	
150V≦V≦450V	0.100MΩ～20.00GΩ	
500V≦V≦5000V	0.100MΩ～50.00GΩ	
電圧レギュレーション	±(1%+5V)[最大定格負荷 → 無負荷]	
抵抗判定レンジ	0.1MΩ～50GΩ	
試験電圧	判定レンジ	精度
50V≦V≦450V	0.1MΩ～1MΩ	読み値の5%+3カウント
	1MΩ～50MΩ	読み値の5%+1カウント
	51MΩ～2GΩ	読み値の10%+1カウント
500V≦V≦1200V	0.1MΩ～1MΩ	読み値の5%+3カウント
	1MΩ～500MΩ	読み値の5%+1カウント
	501MΩ～9.999GΩ	読み値の10%+1カウント
	10G～50GΩ	読み値の20%+1カウント※2
1250V≦V≦5000V	0.1MΩ～1MΩ	読み値の5%+3カウント
	1MΩ～500MΩ	読み値の5%+1カウント
	501MΩ～9.999GΩ	読み値の10%+1カウント
	10G～50GΩ	読み値の15%+1カウント※2

出力ショート時の出力電流	10mA max.
出力インピーダンス	2kΩ
ウィンドウコンパレータ方式	○
上昇時間制御機能	○
RAMP TIME(上昇時間)	0.1～999.9s
下降時間制御機能	○
RAMP DOWN(下降時間)	0.0～999.9s
WAIT TIME (判定保留時間)	0.0～999.9s
タイマー(試験時間)	0.3s～999.9s※3
タイマー精度	±(100ppm+20ms)
GND (グラウンドモード)	ON/OFF

注意: IR試験でグラウンドモードがONの場合には、GND OFFSETを加える必要があります。

※2 IR試験でグラウンドモードがONの場合、50V～1200Vでは最大30GΩの測定、1250V～5000Vでは最大10GΩの測定を保証します

※3 IR試験でグラウンドモードがONの場合、試験時間の最小値は0.5sです。

オプション/Options

オプション型名

OPT01-GP-PT10K	GP-IBユニット
OPT02-LAN-PT10K	LANユニット
GRA-440	EIAラックマウントキット

